



AZ.2710.1.2020.3.MS

Szczecin, dn. 03.03.2020r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy pzp. na: „Zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Odpowiedzi na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniem do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.02.2020 pod numerem 2020/S 024-053077, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://bip.muzeum.szczecin.pl>; pn.: „Zakup sprzętu badawczego dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Pytanie 1 :

Zamawiający wymaga, aby rozdzielczość była nie gorsza niż 2 cm^{-1} przy czym wskazuje na jej zmienność w zakresie co najmniej $0,5 - 16 \text{ cm}^{-1}$. Wskazując na minimalną wymaganą rozdzielczość 2 cm^{-1} , nie może być ona zmienna w zakresie o niższej wartości dolnej. Czy Zamawiający miał tutaj na myśli rozdzielczość zmienną w zakresie co najmniej $2 - 16 \text{ cm}^{-1}$?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ:

DOTYCZY ZADANIA NR 2

SIWZ - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – dla zadania nr 2 – spektrometr FTIR – specyfikacja techniczna dla zadania 2 – rozdzielczość spektralna otrzymuje nowe brzmienie:

zmienna w zakresie co najmniej $2-16 \text{ cm}^{-1}$.

SIWZ - Załącznik nr 3.II – formularz przedmiotowy - DLA ZADANIA 2– SPEKTROMETR FTIR - PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z OPZ – rozdzielczość spektralna otrzymuje nowe brzmienie:

zmienna w zakresie co najmniej 2-16 cm⁻¹.

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający określając parametr „powtarzalność długości fali” ma tutaj na myśli precyzję długości fali (liczby falowej)?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ:

DOTYCZY ZADANIA NR 2

SIWZ - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – dla zadania nr 2 – spektrometr FTIR – specyfikacja techniczna dla zadania 2 – powtarzalność długości fali otrzymuje nowe brzmienie:

precyzja długości fali

SIWZ - Załącznik nr 3.II – formularz przedmiotowy - DLA ZADANIA 2– SPEKTROMETR FTIR - PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z OPZ – powtarzalność długości fali otrzymuje nowe brzmienie:

precyzja długości fali

Pytanie 3 :

W pozycji „Lampa rentgenowska” jest napisane, że napięcie i prąd lampy muszą być dobierane automatycznie przez system na podstawie rodzaju próbki i zakresu analizowanych pierwiastków w celu pełnej optymalizacji pomiaru. Automatyczny dobór parametrów jest możliwy tylko dla metod analizy ilościowej, w ramach kalibracji dotyczącej takiej analizy. Czy Zamawiającemu chodzi o automatyczny dobór parametrów dla analizy ilościowej?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ:

DOTYCZY ZADANIA NR 1

SIWZ - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – dla zadania nr 1 – ZAKUP SPEKTROMETRU FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA NR 1 – SPEKTROMETR FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ – Lampa rentgenowska otrzymuje nowe brzmienie:

Napięcie i prąd lampy muszą być dobierane automatycznie przez system na podstawie rodzaju próbki i zakresu analizowanych pierwiastków dla analizy ilościowej w celu pełnej optymalizacji pomiaru

SIWZ - Załącznik nr 3.1 – formularz przedmiotowy - DLA ZADANIA 1– SPEKTROMETR FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ XRF - PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z OPZ – Lampa rentgenowska otrzymuje nowe brzmienie:

Napięcie i prąd lampy muszą być dobierane automatycznie przez system na podstawie rodzaju próbki i zakresu analizowanych pierwiastków dla analizy ilościowej w celu pełnej optymalizacji pomiaru

Pytanie 4 :

Zamawiający wymaga wyposażenia spektrometru w 5-cio pozycyjny automatyczny zmieniacz filtrów, a następnie wspomina w tej samej technicznej specyfikacji o 3 różnych filtrach. Czy Zamawiający ma na myśli 3 dodatkowe filtry ponad filtry zamontowane w 5-pozycyjnym zmieniaczu filtrów?

Odpowiedź

Liczba wymaganych 3 filtrów dotyczy również filtrów znajdujących się w automatycznym zmieniaczu filtrów. Oznacza to iż Zamawiający zaakceptuje rozwiązania, w których w 5-pozycyjnym zmieniaczu znajdują się dwa pola puste. Niemniej Zamawiający przypomina iż liczba filtrów jest jednym z kryterium punktacji.

Pytanie 5 :

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kamery z rozdzielczością 0,3 Mpx?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ:

DOTYCZY ZADANIA NR 1

SIWZ - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – dla zadania nr 1 – ZAKUP SPEKTROMETRU FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA NR 1 – SPEKTROMETR FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ – Kamera - otrzymuje nowe brzmienie:

Kamera o rozdzielczości min. 0,3 Mpx. zintegrowana z urządzeniem, która umożliwi obrazowanie obszaru, dla którego dokonywany jest pomiar

SIWZ - Załącznik nr 3.1 – formularz przedmiotowy - DLA ZADANIA 1– SPEKTROMETR FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ XRF - PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z OPZ – Kamera - otrzymuje nowe brzmienie:

Kamera o rozdzielczości min. 0,3 Mpx. zintegrowana z urządzeniem, która umożliwi obrazowanie obszaru, dla którego dokonywany jest pomiar

Pytanie 6 :

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania detektora o rozdzielczości <140 eV mierzonej dla linii spektralnej Mn K α , przy ilości zliczeń 250,000 cps?

Odpowiedź

Zamawiający dopuścił zastosowanie detektora o rozdzielczości nie gorszej niż 185 eV. Zaproponowany detektor spełnia więc wymagania Zamawiającego dla linii spektralnej Mn K α , przy ilości zliczeń 250,000 cps

Pytanie 7:

W opisie pozycji „Kolimatory“ jest wzmianka o próbce referencyjnej do kalibracji miejsca pomiarowego. W technice XRF nie ma próbki referencyjnej do kalibracji miejsca pomiarowego. Czy Zamawiającemu chodzi o próbkę referencyjną umożliwiającą sprawdzanie spektrometru w zakresie każdej z metod analizy ilościowej (analiza stopów metali, analiza materiałów ceramicznych).

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ :

DOTYCZY ZADANIA NR 1

SIWZ - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia – dla zadania nr 1 – ZAKUP SPEKTROMETRU FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA NR 1 – SPEKTROMETR FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ – Kolimatory - otrzymuje nowe brzmienie:

próbkę referencyjną umożliwiającą sprawdzanie spektrometru w zakresie każdej z metod analizy ilościowej (analiza stopów metali, analiza materiałów ceramicznych)

SIWZ - Załącznik nr 3.1 – formularz przedmiotowy - DLA ZADANIA 1– SPEKTROMETR FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ XRF - PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z OPZ – Kolimatory - otrzymuje nowe brzmienie:

próbkę referencyjną umożliwiającą sprawdzanie spektrometru w zakresie każdej z metod analizy ilościowej (analiza stopów metali, analiza materiałów ceramicznych)

Pytanie 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać dokonania bezpłatnej naprawy lub wymiany rzeczy na nową (w przypadku braku możliwości naprawy). W obu przypadkach Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania na swój koszt takich czynności jak opakowanie, transport uwzględniający odbiór z siedziby Zamawiającego, załadunek, rozładunek itp.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ zapis:

DOTYCZY ZADANIA NR 1

SIWZ - Załącznik nr 7.I – wzór umowy dla zadania 1 – spektrometr fluorescencji rentgenowskiej §7 – Warunki gwarancji pkt 4) otrzymuje nowe brzmienie:

W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać dokonania bezpłatnej naprawy lub wymiany rzeczy na nową (w przypadku braku możliwości naprawy). W obu przypadkach Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania na swój koszt takich czynności jak opakowanie, transport uwzględniający odbiór z siedziby Zamawiającego, załadunek, rozładunek itp.”

Pytanie 9:

DOTYCZY ZADANIA 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie następującego zapisu:

„Łączna wartość kar umownych określonych w punktach a), b), c), d) nie może przekroczyć 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2) Umowy.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ:

w SIWZ – Załącznik nr nr 7.I – wzór umowy dla zadania 1 – spektrometr XRF w § 8 Kary umowne dodaje się lit g) w brzmieniu

§ 8

Kary umowne

- 1) Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy strony ponoszą odpowiedzialność w formie kar umownych. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:
 - a) Za niedotrzymanie terminu wykonania całego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
 - b) Za nieprzeprowadzenie szkolenia z obsługi i interpretacji wyników w terminie 14 dni od momentu dostawy spektrometru w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
 - c) za niedotrzymanie terminów usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wartości brutto urządzenia, który podlega naprawie (zgodnie z wartościami określonymi na załączonym do oferty wykonawcy wypełnionym formularzu cenowo – przedmiotowym), za każdy dzień zwłoki,
 - d) za niedotrzymanie terminów usunięcia wad przy odbiorze w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
 - e) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego za realizację tej części umowy, od której wykonania odstąpiono.

- f) za brak utrzymania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy, w sytuacji, gdy Wykonawca nie okaże ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
 - g) łączna wartość kar umownych określona w pkt. a,b,c,d nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia brutto.
- 2) Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
- 3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie z należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy naliczonych kar umownych.

Pytanie 10:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać dokonania bezpłatnej naprawy lub wymiany rzeczy na nową (w przypadku braku możliwości naprawy). W obu przypadkach Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania na swój koszt takich czynności jak opakowanie, transport uwzględniający odbiór z siedziby Zamawiającego, załadunek, rozładunek itp.”

Odpowiedź

DOTYCZY ZADANIA NR 2

SIWZ - Załącznik nr 7.II – wzór umowy dla zadania 2 – spektrometr FTIR §7 – Warunki gwarancji pkt 4) otrzymuje nowe brzmienie:

W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać dokonania bezpłatnej naprawy lub wymiany rzeczy na nową (w przypadku braku możliwości naprawy). W obu przypadkach Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania na swój koszt takich czynności jak opakowanie, transport uwzględniający odbiór z siedziby Zamawiającego, załadunek, rozładunek itp.”

Pytanie 11:

DOTYCZY ZADANIA 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie następującego zapisu:

„Łączna wartość kar umownych określonych w punktach a), b), c), d) nie może przekroczyć 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2) Umowy.”

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ:

W SIWZ – Załącznik nr nr 7.II – wzór umowy dla zadania 2 – spektrometr FTIR w § 8 Kary umowne dodaje się lit. g) o brzmieniu:

§ 8

Kary umowne

- 2) Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy strony ponoszą odpowiedzialność w formie kar umownych. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną:
- a) Za niedotrzymanie terminu wykonania całego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
 - b) Za nieprzeprowadzenie szkolenia z obsługi i interpretacji wyników w terminie 14 dni od momentu dostawy spektrometru w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
 - c) za niedotrzymanie terminów usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wartości brutto urządzenia, który podlega naprawie (zgodnie z wartościami określonymi na załączonym do oferty wykonawcy wypełnionym formularzu cenowo – przedmiotowym), za każdy dzień zwłoki,
 - d) za niedotrzymanie terminów usunięcia wad przy odbiorze w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
 - e) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego za realizację tej części umowy, od której wykonania odstąpiono.
 - f) za brak utrzymania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy, w sytuacji, gdy Wykonawca nie okaże ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
 - g) łączna wartość kar umownych określona w pkt. a,b,c,d nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia brutto.
- 2) Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
- 3) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie z należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy naliczonych kar umownych.

Pytanie 12

Czy Zamawiający specyfikując interferometr jako odporny na wibracje i wpływ zmian temperaturowy wymaga interferometru, którego mechanizm skanujący luster jest umieszczony w środku ciężkości interferometru?

Uzasadnienie: Tylko interferometr, którego mechanizm skanujący jest umieszczony w środku ciężkości jego konstrukcji zapewnia należyłą odporność na wibracje i uderzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie narzuca konkretnych rozwiązań technicznych dotyczących zapewnienia odporności na wibrację oraz wpływ zmian temperaturowych.

Pytanie 13

Zamawiający wymaga automatycznego wykonywania testów jakości widm z informowaniem użytkownika m.in. o niepożądanych pasmach spektralnych w widmie tła, nieprawidłowym kształcie pasm, obecności pasm całkowicie absorbujących, nachyleniu linii podstawowej, zbyt małej energii interferogramu.

Czy Zamawiający dopuści system, który pozwala na zapisanie pozyskanego widma tła jako pliku widmowego i jego manualną analizę (ułatwioną przez funkcje oprogramowania) i porównanie przez użytkownika?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści system, który pozwala na zapisanie pozyskanego widma tła jako pliku widmowego i jego manualną analizę (ułatwioną przez funkcje oprogramowania) i porównanie przez użytkownika

.....